

Jornades Tecnològiques SICK

data:	14 Febrer 2012	
Horaris:	10:00 a 13:00 hrs	
Lloc:	Escola del Treball (Barcelona)	saló d'actes
Organitzat:	AMITS Sr. Antoni Rodríguez	SICK Sr. Christian Flaschka
10h	<ul style="list-style-type: none"> • Inici de la jornada Sr. Antoni Rodríguez (President AMITS) <ul style="list-style-type: none"> • AMITS Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors Sr. Sr. Melchor Arcarons (Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial) <ul style="list-style-type: none"> • Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya Sr. Josep M^a Cervera Gerent de SICK <ul style="list-style-type: none"> • SICK Optic Electronic S.A. <p>Solucions SICK en el sector de l'automatització:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deteccions opto- electròniques (25´ presentació+ 5´ preguntes) <ul style="list-style-type: none"> ○ Distàncies (telèmetres - micròmetres) ○ Instrumentació (nivells - temperatures -caudals) ○ Detecció especial (macules - marques invisibles) 	
Pausa	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologies de mesura làser i traçabilitat industrial (25´ presentació+ 5´ preguntes) <ul style="list-style-type: none"> ○ Codis de Barres ○ RFiD ○ Codis 2D datamatrix ○ Mesura làser (time of Flight) • Tecnologies en visió artificial industrial (25´ presentació+ 5´ preguntes) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 i 3 Dimensions ○ Exemples de solucions • Tecnologies en Seguretat Industrial (25´ presentació+ 5´ preguntes) <ul style="list-style-type: none"> ○ Funcions de seguretat (Paro Emergència, Accessos Persones/càrregues, Inici de cicle màquines) ○ Autòmats Industrials de Seguretat Programables ○ Bus Industrial de Seguretat 	
13h	<ul style="list-style-type: none"> ○ Conclusions finals i cloenda 	